

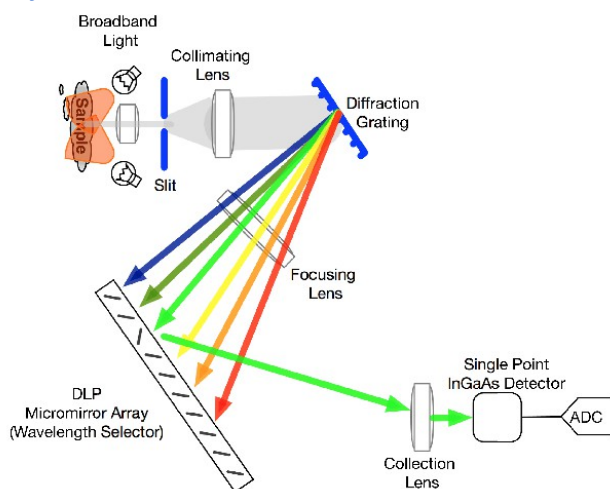
## Materialanalyse mit NIR-Spektrometer

- Messung diffuser Reflektion
- kompakt und einfach zu bedienen
- geringes Rauschen
- hoher Dynamikbereich



## Funktionsweise

LuxFlux nutzt die Texas Instruments DLP® Technologie in Kombination mit einem rauscharmen InGaAs-Punkt-detektor mit hohem Dynamikbereich



## Optionen

Verschiedene Messköpfe verfügbar:  
 - Glasfaseranschluss (SMA905)  
 - Küvettenhalter für Transmissionsmessungen  
 Alle Module auch ohne Gehäuse erhältlich

## Kalibration

Die Kalibration erfolgt werksseitig mit einem SRM-2036 Wellenlängen-Standard (NIST nachverfolgbar) und einem Spektralweißstandard.

## Spezifikation

Arbeitsbereich	900 - 1700 nm
Arbeitsabstand	<2 mm
Spektrale Auflösung	10 nm
Genauigkeit	±2 nm
Eingangsspalt	25 µm
Signal-Rauschverhältnis	> 5000
Nutzbare Pixel	583
Zeit pro Scan	< 1 sec
Detektor	InGaAs, 1 mm Durchmesser
A/D Wandler	24 Bit / 30 kHz
Lichtquelle	Wolfram-Halogen-Lampen
Betriebstemperatur	10 – 40 °C
Abmessungen	76mm x 82mm x 27mm
Gewicht	87 g
Stromversorgung	5V, 500mA via USB
Betriebssystem	Windows 7 + 10, OSX 10.10+, Linux